### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

## (43) 国際公開日 2004年11月4日(04.11.2004)

PCT

# (10) 国際公開番号 WO 2004/095831 A1

(51) 国際特許分類7:

H04N 5/335, H01L 27/146

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/005334

(22) 国際出願日:

· . . .

2004年4月14日(14.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特顯2003-120343

V 2003年4月24日(24.04.2003) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林 宏也 (KOBAYASHI, Hiroya) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜 松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社 内Shizuoka (JP). 赤堀寛 (AKAHORI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜

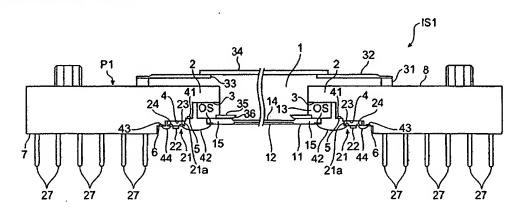
松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 村松 雅治 (MURAMATSU, Masaharu) [JP/JP]; 〒4358558 静岡 県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式 会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 長谷川 芳樹 , 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目10番6号 銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG,

[続葉有]

(54) Title: SOLID-STATE IMAGING DEVICE

(54) 発明の名称: 固体撮像装置



(57) Abstract: A solid-state imaging device (IS1) comprising a package (P1), a CCD chip (11) and a chip resistance array (21).

A mounting unit (2) for mounting the CCD chip (11) and the chip resistance array (21) thereon is provided to the package (P1) so as to protrude into a hollow (1). The mounting unit (2) has a first plane unit (3) and a second plane unit (4) that are formed with a step difference. The CCD chip (11) is placed on the first plane unit (3) via a spacer (13) and fixed. The chip resistance array (21) is placed on the second plane unit (4) and fixed. The chip resistance array (21) is disposed so as to be closed to the CCD chip (11) by using the step difference between the first plane unit (3) and the second plane unit (4).

5831 A1

# WO 2004/095831 A1

NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, のガイダンスノート」を参照。 CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, 2文字コード及び他の略語については、定期発行される CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, 各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

### 添付公開書類:

国際調査報告書